

Judul:

Kelvin probe force microscopy : measuring and compensating electrostatic forces

Pengarang/Penulis:

Sadewasser, Sascha

Subjek:

Atomic force microscopy ; Electrostatics--Measurement ; Kelvin-Sonde

Nomor Panggil:

e20405909

Penerbitan:

Springer

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)